

PCN-00655R3

2012年6月19日

お客様 各位

東京エレクトロニクス株式会社
パネトロン プロダクト営業推進部
菱田 俊昭

Everspin Technologies 社 仕様改良およびテスト工場追加のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、Everspin Technologies 社より既報の PCN-655 (ASE 台湾 アセンブリ工場追加) に関して追加情報がありましたので下記ご報告申し上げます。

敬具

記

1. ASE 台湾 アセンブリ品について下記 2 点の情報の追加
 - ① 温度拡張品については、耐磁性能が強化されます。(下記 4.ご参照)
 - ② テスト工場として UTAC 台湾が追加されます。(下記 5.ご参照)
2. 理由
生産能力向上および特性改善のため
3. 対象製品
 - ①および②適用

<温度拡張品>

構成	型式	型式	パッケージ
4Mb(256Kx16)	MR2A16ACYS35	MR2A16AVYS35	TSOP-44
1Mb(64K x16)	MR0A16ACYS35	MR0A16AVYS35	TSOP-44
4Mb(512K x8)	MR2A08ACYS35	MR2A08AMYS35	TSOP-44

②のみ適用

<コマーシャル温度品(0-70°)>

構成	型式	パッケージ
4Mb(256Kx16)	MR2A16AYS35	TSOP-44
1Mb(64K x16)	MR0A16AYS35	TSOP-44
4Mb(512K x8)	MR2A08AYS35	TSOP-44

4. 温度拡張品は耐磁性能が改善されています。(データコード”1205”以降に適用)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Maximum magnetic field during write	$H_{\max \text{ write}}$	10,000 (従来品: 2,000)	A/m
Maximum magnetic field during read or standby	$H_{\max \text{ read}}$	10,000 (従来品: 8,000)	A/m

5. 追加テスト工場(UTAC 台湾)品について、その品質および信頼性について従来工場との差異はございません。

6. 従来品との外観上の差異

PCN-1893 適用前のロット

*テスト工場を示すトレースコードの 3文字目にて確認

“Q”= Freescale マレーシア：従来のテスト工場および従来スペックを示す。

“T” = UTAC 台湾: 追加テスト工場および温度拡張品については耐磁性能改善品を示す。

PCN-1893 適用後のロット

*テスト工場を示すトレースコードが省略されたため 1文字目 のアセンブリサイトで確認

“Q”= Freescale マレーシア：従来のテスト工場および従来スペックを示す

“J” = ASE 台湾：追加テスト工場および温度拡張品については耐磁性能改善品を示す。

<ご参考 : PCN-1893>

(トレースコードからウェファー工場およびテスト工場の情報を省略。2011/12/30以降)

(変更前フォーマット:10桁)

FATWLYYWWz

F:ウェファー工場

A:アセンブリ地

T:最終テスト地

(Q=Freescal マレーシア、T=UTAC 台湾)

WL:ウェファーロット番号

YY:製造年

WW:製造週

z:アセンブリロット分割時使用 (オプション表示)

(変更後フォーマット:8桁)

AWLYYWWz

A:アセンブリ地

WL:ウェファーロット番号

YY:製造年

WW:製造週

z:アセンブリロット分割時使用 (オプション表示)

7. 追加および変更時期

在庫終了後順次実施

ご不明な点等ございましたら、営業担当もしくは下記宛てお問合せのほどお願い申し上げます。 email:everspin@teldevice.co.jp

以上